

XJIPC OpenIR > 固体辐射物理研究室

## 一种基于光栅的电荷耦合器件电荷转移效率通用测试方法

李豫东<sup>1</sup>, 文林<sup>1</sup>, 冯建<sup>1</sup>, 张兴亮<sup>1</sup>, 魏峰<sup>1</sup>

2017-09-08

专利权利人 中国科学院新疆理化技术研究所

授权日期 2019-08-16

专利类型 发明专利

**摘要** 本发明涉及一种基于光栅的电荷耦合器件电荷转移效率通用测试方法,该方法涉及装置是由静电试验平台、积分型电荷读出电路、金属光栅掩膜、硅基电荷耦合器件结构、电荷、三相硅基电荷转移、电荷、光学电荷读出电路组成的,将电荷耦合器件样品芯片分装于光栅出口,激光进行扫描测试,计算出A、B、C三个通道像场所有像素位置灰度值的平均值,再进行电荷测试,计算出三个通道电荷所有像素位置灰度值的平均值,通过计算得到A、B、C三个通道相对于A通道的增益系数,计算出每个通道从三个通道像场的所有像素位置灰度值的平均值,计算电荷转移效率,计算出每个通道中心在的25个像素的像场灰度值之和,最后计算出水平转移效率和垂直转移效率,本发明具有通用性、操作简便、精度高。

申请日期 2017-06-28

专利状态 已授权

申请号 CN201710507786.X

公开(公告)号 CN107144755B

代理机构 乌鲁木齐中融知识产权事务所 65106

文献类型 [专利](#)

专利链接 <http://it.khanshanzhu.cn/handle/365002/6444>

专利 固体辐射物理研究室

推荐引用格式 李豫东,文林,冯建等.一种基于光栅的电荷耦合器件电荷转移效率通用测试方法. CN107144755B(P). 2017-09-08. GB/T 7714

系统包含的文件 附件无相关文件.

所有评论 (0) 暂无评论

路径特别提示: 本系统中所有文件均受版权保护, 并保留所有权利。

### 个性服务

我的主页

我的收藏列表

我的动态统计

导出为Endnote文件

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章

张兴亮的文章

魏峰的文章

我的学术

最新学术中相似的文章

李豫东的文章

文林的文章

冯建的文章